

**Day1 2021年12月7日（火） 9:00-11:55 General トラック**

Time	Title	Presenter
9:00	General トラック 開会	
9:05	主催者挨拶	鶴川 久
9:25	半導体デバイスおよびテストのトレンドとテラダインの新製品ロードマップ	小倉 光裕／穂園 和郎
10:10	休憩	
10:20	TEMSを利用したテストセル稼働監視手法	工藤 邦彦
10:50	ポートブリッジの活用：ベンチ評価から量産まで	小松崎 裕之
11:20	ATE自律化への取り組み：ビッグデータの活用に向けて	穂園 和郎
11:50	General トラック 閉会	

**Day2 2021年12月8日（水） 9:00-11:20 UltraFLEX & x750 トラック**

Time	Title	Presenter
9:00	UltraFLEX & x750 トラック 開会	
9:05	UltraFLEXファミリーにおける多様かつ高品質なクロックの実現	秋元 一志
9:35	高度なPI/SI要求仕様を実現するUltraFLEXplusインスツルメントと新しいDIBアーキテクチャ	島袋 竹志
10:05	休憩	
10:15	5Gミリ波デバイスのSパラメータ測定手法	タビーブ サイエッド
10:45	イールド、品質向上のためのMBISTとSCANの解析手法	蓑田 貴宏
11:15	UltraFLEX & x750 トラック 閉会	

**Day2 2021年12月8日（水） 13:00-15:20 ETS トラック**

Time	Title	Presenter
13:00	ETS トラック 開会	
13:05	ETS-88 DUO MOSFET マルチサイト・ゲートドライバ・ソリューション	井上 和総
13:35	HPUによる新しいTrr（逆回復時間）テストソリューション	中村 さくら
14:05	休憩	
14:15	車載電池監視システムデバイスのテスト技術と動向	町 英一郎
14:45	アナログ、デジタルテストに対応したETS-800 Shmoo ツールのご紹介	船越 智志
15:15	ETS トラック 閉会	